



Chers Collègues,

Comme vous le savez peut-être, en dehors de mes activités d'accréditeurs, il y a plus de vingt ans que je consacre une partie de mon temps libre à la diffusion des informations relatives à la métrologie (maîtrise des processus de mesure, gestion des équipements de mesure, raccordement au système international d'unités SI, etc.). Je suis entre autre membre du comité d'organisation de ce congrès depuis 1985.

Depuis de nombreuses années les comités scientifique et d'organisation sont composés de volontaires de différents pays. Cette année :

M. BORSIC Croatie - Président - **Société Croate de Métrologie** - Croatie  
M. DE LEER - **NMI** - Pays-Bas  
Mme FILIPE - **IPQ** - Portugal  
M. GUERDAT - **Manufacture des Montres Rolex** – Suisse  
M. KOCH - **PTB** – Allemagne  
Jean-François MAGANA **OIML** - France  
José MONTES - **SOLVAY** - Belgique  
Leslie PENDRILL - **SP** - Suède  
Stuart POLLITT - **NPL** - Royaume-Uni  
Bruno VAUCHER - **METAS** – Suisse  
M. REGTIEN - **Université de Twente** - Pays-Bas  
Mme SASSI - **INRIM** - Italie  
M. SLINDE - **Justervesenet** - Norvège

Lors de sa précédente édition le congrès international de métrologie a accueilli les représentants des différents pays participant à la cinquantième Conférence Internationale de Métrologie Légale (CIML).

Cette année le bureau du Collège Français de Métrologie a décidé de renforcer son impact européen au cours des cinq prochaines années. Nous avons donc décidé le 25 mai d'offrir à l'ensemble des laboratoires accrédités (Essais et Etalonnage) la possibilité de participer à ce Congrès à un prix réduit en faisant bénéficier tous vos accrédités d'une **remise exceptionnelle de 15 %** sur simple indication, lors de leur inscription, du nom de l'organisme d'accréditation et du numéro d'accréditation que vous leur avez attribué.

Espérant que ce service ajouté à votre activité d'accréditeur recevra le meilleur accueil auprès de votre organisme, je vous saurai gré de bien vouloir adresser à vos accrédités une copie du programme ci-joint, ou de les renvoyer vers la page d'accueil du site d'EA.

Bien évidemment l'ensemble des conférences fait l'objet d'une traduction simultanée et est accessible en Anglais et en Français.

Patrick Reposeur  
Membre du comité d'organisation

Dear Colleagues,

As you know it maybe, except my accreditation activities, more than twenty years ago I dedicate a part of my spare time to the diffusion of the information relative to the metrology (mastery of the processes of measure, management of the equipments of measure, traceability to the international system of units (SI), etc.). I am among others member of the steering committee of this congress since 1985.

For several years committees scientist and of organization consist of volunteers of various countries. This year:

During its previous edition the international congress of metrology welcomed the representatives of the various countries participating in the fiftieth International Conference of Legal Metrology (CIML).

This year the board of the CFM (French Metrologist Society) decided to strengthen its European impact during the next five years. We thus decided on May 25th to offer to all the accredited laboratories (Test and Calibration) the possibility of participating in this Congress at a reduced cost by making all your accredited of an **exceptional discount benefit of 15 %** on simple indication, during their registration, of the name of the accreditation body and the number of accreditation which you attributed them.

Expecting that this added service to your accreditation's activity will receive the best reception with your body, I shall be grateful to you for wanting send to your accredited a copy of the attached program, or to adress them towards the homepage of the EA website.

Naturally all the conferences been the object of a simultaneous translation and is accessible in English and in French by a simultaneous translation

Antonio Mazzei  
Président du CFM